

MEMS式近红外光谱仪（宽波段）

采用MEMS扫描镜双鉴探测技术的新型近红外光谱仪。
利用双鉴探测技术，实现了传统的近红外光谱仪所无法覆盖的波长领域的不同波长组合。



IrSys type I, II, III

IrSys type OEM



IrSys type I, II, III, OEM

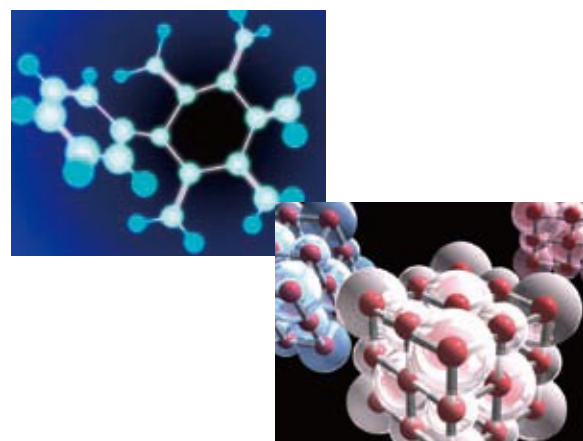
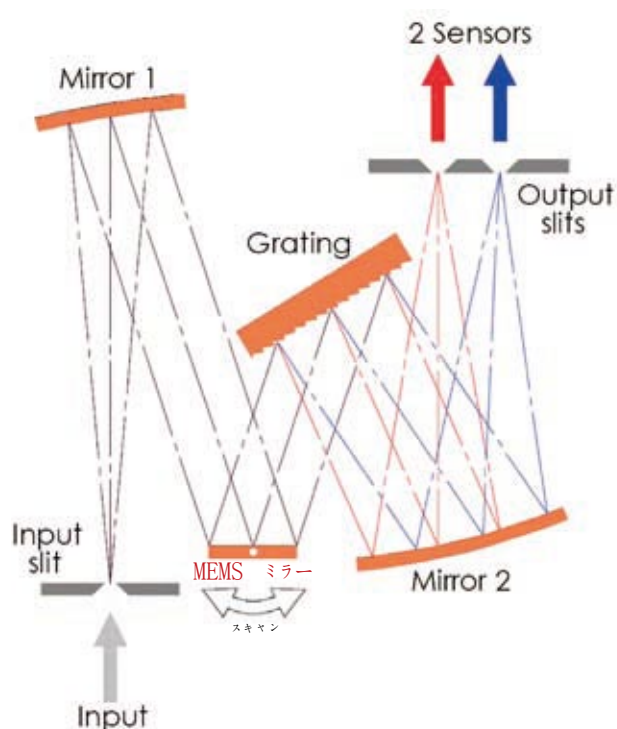
■ 产品特征：

双鉴探测技术，可覆盖宽波段测量；
优异的波长分辨率；
同一规格中全球最小的光谱仪。

■ 产品用途

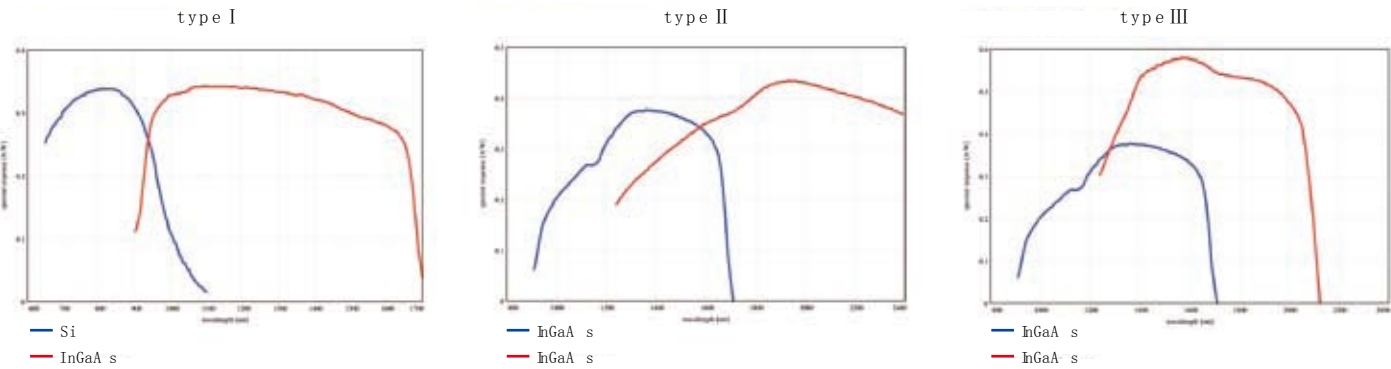
制药・食品・谷物・饮料・化学・石油・燃料行业中的“原材料验收、产品的出厂检验、反应及混合的过程监视”等“非破坏性定量分析・多成分同时定量分析”等不同应用领域。FT-NIR领域。

■ 基于MEMS技术的全新分光系统



通过把MEMS元件嵌入到众所周知的Czerny-Turner光学系统内，成功实现了行业首个应用双鉴探测技术的分光光学系统。基于该技术的成功应用，消除了受光元件对测量波长的影响，进一步开拓了应用领域，成为推进新思维光谱仪之典范。

不同系列的光谱灵敏度特性对比



产品系列

型 号	IrSys type I	IrSys type II	IrSys type III	IrSys type integrated-OEM ※4	IrSys type simple-OE M ※5
测定波长范围	660～1,730nm	910～2,390nm	910～2,100nm	适于各种光谱仪	适于各种光谱仪
受光元件	Si and InGaAs	InGaAs×2			
波长分辨率	9nm(入射狭缝300μm)	13nm(入射狭缝300μm)			
标准狭缝宽度 ※1	300μm				
狭缝高度	1.8mm				
测定时间（单次扫描）	4ms				
信噪比(S/N)	7000 : 1	1000 : 1		适于各种光谱仪	
波长稳定性(扫描50次时)	<0.5nm				
波长再现性(扫描50次时)	±0.05nm				
杂散光（@1450nm）	<0.1%T				
温度依赖性	0.01nm/K				
工作温度范围	5～50℃				
光纤连接器	SMA905				
附带光纤 ※2	石英光纤：L=1m, 芯径=φ400μm, NA=0.22				
输入电气特性 ※3	DC24V(18～36V)/140mA				
OS应用环境	Windows 2000/XP/Vista				
接 口	USB			USB/RS-435	
外形尺寸(WDH)	80×130×120mm			66×80×108mm	34×66×108mm
重 量	750g			——	——

※1. 波长选项: 350、250、200、150μm中任意选择。
※2. 使用NA值大于标准光纤的光纤时, 杂散光会有所增多。
※3. 附带通用ACDC电源。
※4. 比标准产品还小。
※5. 拆卸type integrated-OEM灯罩, 可实现产品小型化。



〒101-0041 東京都千代田区神田須田町1-2
TEL : 03-3258-1238 (代) FAX : 03-3258-5689
URL : www.klv.co.jp E-mail : toiawase@klv.co.jp

● 为了确保产品使用的正确性和安全性, 请在使用本产品之前认真阅读《产品使用说明书》。
● 根据产品改良情况会随时更新产品规格及设计信息。
● 因印刷效果的影响, 产品实物颜色和上述印刷效果间有时会有一定差异。
● 上述宣传册中的记载内容会根据产品改良等随时更新, 敬请谅解。

代理店